

При включении и выключении освещения (лампа накаливания) наблюдалось изменение тока, проходящей через исследуемые углеродные пленки. Из разности токов при освещении и его отсутствия были рассчитаны величины фототоков при различных условиях. Наибольшее значение фототока наблюдалось для углеродных пленок, выращенных на кремниевых подложках и превышало 2 мА при напряжении на образце 8 В. Следует отметить, что вольт-амперные характеристики имели линейный вид, что указывает на отсутствие выпрямляющего действия контактов на протекающий ток. Для подложек из кварца величина фототока была наименьшей и составляла в максимуме ~75 нА.

С помощью формулы

$$I_{ph} = I_1 + I_d$$

где II – ток при освещении, Id - темневой ток, были определены фототоки для всех образцов.

Из полученных результатов следует, что в тонких углеродных пленках, полученных методом плазменного осаждения и последующей термообработки, проявляют зависимость сопротивления от освещения. Уменьшение сопротивления связано с фотогенерацией носителей заряда, приводящее к увеличению концентрации носителей заряда. Зависимость фототока от напряжения обусловлена эффективным разделением фотогенерируемых носителей заряда электрическим напряжением. Такое воздействие приводит к уменьшению интенсивности рекомбинационных процессов электронно-дырочных пар. Зависимость фототока от температуры зависит от подложки. При уменьшении температуры до 1000 К величина фототока уменьшается для всех образцов. Возможно это связано с изменением плотности состояний при уменьшении температуры. Увеличение температуры термообработки от 6500 до 7500 С при синтезе плёнок не вызывает заметного изменения зависимости Iph(V) для Si подложек, в то время как для SiO2 Iph(V) заметно возрастает. Возможно это связано с более эффективным формирование поликристаллических структур на Si подложке, которые ответственны за наблюдаемый фотоэффект. Это подтверждается значительно высокими значениями фототока, наблюдаемых для образцов на Si подложках

## Список публикаций:

[1] Neustroev E. P., Popov V. I., Prokopiev A. R., Davydova Z. Y., Semenov S. O., Formation of nanographite on SiO2 substrate by plasma deposition of carbon and subsequent annealing // AIP Conference Proceedings - 2019. Vol. 2179. - P. 020019(1-8)

## Поляризационные свойства экологически чистых твёрдых растворов состава (1-x-y) NaNbO<sub>3</sub> – x KNbO<sub>3</sub>– y Cd<sub>0.5</sub>NbO<sub>3</sub> (0.05≤ x≤0.30, y=0.15) Мойса Максим Олегович Андрюшин Константин Петрович Южсный федеральный университет Резниченко Лариса Андреевна, д.ф.-м.н. <u>maksim.moysa@mail.ru</u>

Пьезоэлектрические материалы играют важную роль в электронных устройствах, таких как измерители давления, датчики, ускорители, ультразвуковые двигатели, преобразователи и др. Наиболее широко используемые пьезоэлектрические материалы представляют собой системы на основе композиций состава PbTiO<sub>3</sub>-PbZrO<sub>3</sub> (PZT), что обусловлено их превосходными пьезоэлектрическими свойствами. Развитие законодательной базы в области охраны окружающей среды вынуждает искать бессвинцовые материалы, способные заменить PZT-керамики, что позволит снизить антропогенное загрязнение. Ввиду того, что большинство приборов работает в условиях вариации внешних воздействий (температуры, постоянного/переменного электрического поля и др.), актуальной задачей на сегодня является установление зависимости электрофизических свойств, в частности, поляризационных от температуры при нагреве и охлаждении образцов, что и стало предметом нашего исследования, в котором в качестве объектов выступили твёрдые растворы (TP) трёхкомпонентной системы (1-x-y) NaNbO<sub>3</sub> – x KNbO<sub>3</sub> – y Cd<sub>0.5</sub>NbO<sub>3</sub> [1].

Рассмотрены ТР с  $x=0.05\div0.30$ , y=0.15,  $\Delta x=0.05$ . Петли диэлектрического гистерезиса исследовались осциллографическим методом Сойера – Тауэра (f = 50 Гц,  $T = 290\div431$  K), при этом были рассчитаны спонтанная,  $P_s$ , и остаточная,  $P_r$ , поляризации, а также напряженность коэрцитивного поля,  $E_c$ . Зависимости ( $P_s$ ,  $P_r$ ,  $E_c$ )(T) были аппроксимированы полиномом второй степени.

Установлено, что во всех исследованных ТР петли диэлектрического гистерезиса формируются во всем исследовательском температурном диапазоне. Необходимо отметить, что по мере увеличения концентрации KNbO<sub>3</sub> получение классической сегнетоэлектрической (CЭ) петли *P-E* при комнатной температуре затруднено, то есть происходит формирование (*P-E*)- зависимости, близкой по виду к СЭ, но с округлыми концами. Однако, при увеличении температуры указанный эффект нивелируется. *P<sub>s</sub>*, *P<sub>r</sub>*, *E<sub>c</sub>* с ростом температуры убывают, а при охлаждении образцов, наоборот, происходит возрастание указанных вличин. Так, в TP с *x*=0.05 и *x*=0.20 *P<sub>s</sub>* изменяется линейно в диапазонах (17÷12)  $\mu$ C/cm<sup>2</sup> и (13÷11)  $\mu$ C/cm<sup>2</sup>, *E<sub>c</sub>* также линейно снижается при нагреве в интервале (5.5-3.3) kV/cm и возрастает при охлаждении в интервале (3.2÷5.5) kV/cm. В TP с *x*=0.10 и *x*=0.15 имеется ряд особенностей. Так, *P<sub>s</sub>* убывает линейно в диапазонах (22÷18)  $\mu$ C/cm<sup>2</sup> и (16÷13)  $\mu$ C/cm<sup>2</sup>, соответственно, а *E<sub>c</sub>* снижается при нагреве по квадратичному закону в диапазонах (5.5÷3.0) kV/cm и возрастает в диапазоне (2.5÷7.0) kV/cm при охлаждении (рис. 1). Указанные TP характеризуются стремительным снижением коэрцитивных полей с ростом температуры, тогда как спонтанная и остаточная поляризации убывают медленно. Необходимо отметить, что в остальных TP снижение *P<sub>s</sub>*, *P<sub>r</sub>*, *E<sub>c</sub>* по мере роста температуры не превышает (5÷15%).



рис. 1 Зависимость формы петель диэлектрического гистерезиса (a),  $P_s$ ,  $P_r$ ,  $E_c$  (б) TP состава (1-x-y) NaNbO<sub>3</sub> – x KNbO<sub>3</sub> – y Cd<sub>0.5</sub>NbO<sub>3</sub> (x=0.15, y=0.15) от температуры

На рис. 2 представлены зависимости поляризационных характеристик от температуры в TP с x=0.30. Установлено, что при указанном содержании KNbO<sub>3</sub> исследованные зависимости имеют экстремум как при нагреве, так и при охлаждении в окрестности 370K.

Наблюдаемое для всех исследованных TP снижение величины коэрцитивного поля с ростом температуры, вероятно, связано с тем, что при возрастании температуры снижается энергетический барьер для переключения доменов, вследствие чего уменьшается величина внешнего электрического поля, необходимого для перестройки доменной структуры. Формирование экстремумов в различных составах может быть связано с некими структурными неустойчивостями в данных объектах, что требует дополнительных рентгенографических исследований.



рис.2 Зависимость формы петель диэлектрического гистерезиса (a),  $P_s$ ,  $P_r$ ,  $E_c$  (б) TP состава (1-x-y) NaNbO<sub>3</sub> – x KNbO<sub>3</sub> – y Cd<sub>0.5</sub>NbO<sub>3</sub> (x=0.30, y=0.15) от температуры

Полученные результаты целесообразно использовать при разработке соответствующих устройств электронной техники.

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс исследовательских лабораторий ЮФУ-2020)

## Список публикаций:

[1] Andryushin K.P., Sodium solutions of sodium- potassium-cadmium. Preparation, structure, electrophysical and thermofrequency properties / K.P. Andryushin, I.N. Andryushina, L.A. Reznichenko // LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. 61 р. (Монография). ISBN 978-3-8454-0867-5. https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8454-0867-5/solid-solutions-of-sodium-potassium-cadmium-niobats?search=Preparation,%20structure

## Расчет спектра комбинационного рассеяния силиценовых нанолент Муксунов Никита Янович

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова Шарин Егор Петрович, к.ф.-м.н. <u>muksunov97@mail.ru</u>

В последнее время двумерные материалы вызвали большой интерес благодаря их уникальным свойствам. Так, например, недавно был теоретически предсказан и синтезирован экспериментально силицен.

Исследования силиценовых нанолент (SiNR) с помощью сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии подтвердили тесную связь между структурой и свойствами, предоставляя структурнную и электронную информацию в атомном масштабе.

В данной работе на основе метода функционала плотности произведен расчет колебательного спектра силиценовых нанолент. Края которых пассивированы атомами водорода. В качестве инструмента *ab initio* расчетов использовался программный комплекс Quantum Espresso [1], предназначенный для моделирования атомно-молекулярных и электронно-ядерных систем методами квантовой механики и молекулярной динамики. Взаимодействие между ионами и электронами моделируемой системы описывается посредством псевдопотенциального подхода и метода присоединенных плоских волн. *Ab initio* моделирование проводилось в рамках теории функционала плотности с использованием приближения локальной плотности (LDA). Для ускорения сходимости в расчетах выбрана величина энергии «обрезания» *Ecut*=60 Ry подобно расчетной процедуре, изложенной в работе [2]. Разбиение обратного пространства на сетку бхбх1 осуществлялось посредством использования метода Монхорста-Пака [3]. Во избежание взаимодействия между слоями расстояние между ними устанавливалось равным 20 Å.

В работе рассчитаны Raman – спектры трех силиценовых нанолент с краями типа «кресло» пассивированными атомами водорода с шириной N=3, N=5 и N=7 (3-ASiNR, 5-ASiNR,7-ASiNR) соответственно. На рис.1 показан Raman - спектр силиценовой наноленты с краями типа «кресло» шириной N=3 (3-ASiNR)